

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 30.01.2023 16:41:18

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98bc3de2ab454b4659d961f749

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

## Рабочая программа дисциплины (модуля)

# Микро- и наносистемы в технике и технологии

Закреплена за подразделением

Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки

28.04.01 НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

Профиль

Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники

Квалификация

**Магистр**

Форма обучения

**очная**

Общая трудоемкость

**4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану

144

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет с оценкой 1

аудиторные занятия

68

самостоятельная работа

76

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	68	68	68	68
Контактная работа	68	68	68	68
Сам. работа	76	76	76	76
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

*дфмн, профессор, Панина Лариса Владимировна; ассистент, Евстигнеева Светлана Алексеевна*

Рабочая программа

**Микро- и наносистемы в технике и технологии**

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 28.04.01 НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, 28.04.01-МНТМ-22-1.plx Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

**Кафедра технологии материалов электроники**

Протокол от 18.06.2020 г., №10

Руководитель подразделения Костишин Владимир Григорьевич

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ**

1.1	Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о компонентах микросистемной техники, физических принципах их функционирования, базовых и специальных технологических операциях, используемых при создании элементов и устройств микросистемной техники. Научить физическим основам функционирования элементов и устройств микросистемной техники; обосновывать выбор материалов, методам их получения с заданными структурными и физическими свойствами на основе микро- нанотехнологий.
-----	--

**2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Блок ОП:		Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Высоковакуумное оборудование в технологии nano- и микросистем	
2.2.2	Компьютерные технологии в научных исследованиях	
2.2.3	Магнитные материалы для микро- и наносистем	
2.2.4	Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники	
2.2.5	Методы исследования материалов	
2.2.6	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур	
2.2.7	Микропроцессорные и микроконтроллерные системы. Часть 2	
2.2.8	Научно-исследовательская практика	
2.2.9	Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 2	
2.2.10	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники	
2.2.11	Металлуглеродные композиционные наноматериалы	
2.2.12	Методы синтеза углеродных наноматериалов	
2.2.13	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии	
2.2.14	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)	
2.2.15	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык)	
2.2.16	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)	
2.2.17	Приборы и устройства магнитоэлектроники	
2.2.18	Процессы получения наночастиц и наноматериалов	
2.2.19	Технологии получения материалов	
2.2.20	Электреты, мультиферроики, магнитоэлектрические явления	
2.2.21	Элионная технология в микро- и наноиндустрии	
2.2.22	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.23	Преддипломная практика	

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ**

<b>ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области</b>
<b>Знать:</b>
ОПК-4-32 основные методы диагностики микро- и наномасштабных объектов, анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем
ОПК-4-31 методы анализа частотных и переходных характеристик
<b>ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их внедрение в области материаловедения и технологии материалов для микро- и наносистем в соответствии с тенденциями и перспективами развития микро- и наносистемной техники, энергосберегающих технологий и использованием последних достижений науки и техники</b>
<b>Знать:</b>
ПК-4-31 физико-технологические и экономические ограничения интеграции и миниатюризации электронной компонентной базы, компонентной базы МЭМС и МСТ

<b>ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области</b>
<b>Знать:</b>
ОПК-4-33 базовые физические и физико-химические процессы микро- и нанотехнологий как основу производства материалов, компонентов и изделий нано- и микросистемной техники, электроники, микро- и нанoeлектроники
<b>УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, выработать стратегию действий</b>
<b>Знать:</b>
УК-1-33 основы материаловедения наноструктурированных материалов
УК-1-32 основы теории электромагнитного поля
УК-1-31 основы теории электрических и магнитных, пассивных и активных, линейных и нелинейных цепей с сосредоточенными и с распределенными параметрами
<b>ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области</b>
<b>Уметь:</b>
ОПК-4-У3 применять методы и средства измерения физических величин наноструктурированных объектов
<b>ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их внедрение в области материаловедения и технологии материалов для микро- и наносистем в соответствии с тенденциями и перспективами развития микро- и наносистемной техники, энергосберегающих технологий и использованием последних достижений науки и техники</b>
<b>Уметь:</b>
ПК-4-У1 применять методы моделирования в материаловедении для приборов и устройств микросистемной техники и твердотельной нанoeлектроники
<b>ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области</b>
<b>Уметь:</b>
ОПК-4-У2 анализировать воздействие сигналов на линейные и нелинейные цепи, производить расчет усилителей, генераторов, стабилизаторов и преобразователей электрических сигналов
<b>УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, выработать стратегию действий</b>
<b>Уметь:</b>
УК-1-У1 вести поиск литературы и объектов интеллектуальной собственности в области профессиональных интересов
<b>ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области</b>
<b>Уметь:</b>
ОПК-4-У1 применять математические методы, физические и химические законы для решения практических задач
<b>ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их внедрение в области материаловедения и технологии материалов для микро- и наносистем в соответствии с тенденциями и перспективами развития микро- и наносистемной техники, энергосберегающих технологий и использованием последних достижений науки и техники</b>
<b>Владеть:</b>
ПК-4-В1 сведениями об основных тенденциях развития нано- и микросистемной техники, твердотельной электроники, а также о новейших разработках наноматериалов и компонентной базы в указанных областях

**УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий**

**Владеть:**

УК-1-В1 методами построения современных проблемно-ориентированных прикладных программных средств в области нанотехнологий и микросистем

**ОПК-4: Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области**

**Владеть:**

ОПК-4-В1 методами исследования наноструктурированных материалов и систем

ОПК-4-В2 навыками работы с измерительной аппаратурой, предназначенной для определения параметров и характеристик материалов и элементов нано- и микросистемной техники и твердотельной электроники

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	<b>Раздел 1. Введение, обобщенное описание компонентов микросистемной техники</b>							
1.1	Классификация компонентов микросистемной техники по функциональному назначению и принципу действия. Базовые конструкции и обобщенное описание компонентов. /Лек/	1	5	УК-1-31 ОПК-4-31 ОПК-4-32 ОПК-4-33 ПК-4-31	Л1.4 Л1.7Л2.7 Э4		КМ1	
1.2	Бинарные системы, элементы памяти /Пр/	1	10	ПК-4-У1	Л1.2 Л1.4			Р3
1.3	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	1	13	УК-1-У1 ПК-4-В1	Л1.2 Л1.4 Л1.8Л2.7			
	<b>Раздел 2. Материалы микросистемной техники</b>							
2.1	Классификация материалов микросистемной техники. Конструкционные, функционально-активные и адаптивные материалы. Критерии выбора и совместимости материалов. /Лек/	1	5	УК-1-32 ПК-4-31	Л1.2 Л1.4 Л1.8 Э4 Э5		КМ1	
2.2	Проектирование функционально-активных материалов и материалов с памятью формы. /Пр/	1	10	ПК-4-У1	Л1.1 Л1.7			Р4
2.3	Эллипсометрические методы измерения параметров наноразмерных структур /Лаб/	1	8	УК-1-В1 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.7 Л1.8			Р1
2.4	Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/	1	15	УК-1-У1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.3 Э5			
	<b>Раздел 3. Компоненты микросистемной техники</b>							

3.1	Классический электромеханический и пьезоэлектрический преобразователи; Проявление размерных эффектов и эффектов масштабирования при электростатических и электромагнитных взаимодействиях /Лек/	1	2	УК-1-31 УК-1-33	Л1.4 Л1.8		КМ1	
3.2	Выполнение домашнего задания, подготовка и написание реферата /Ср/	1	20	УК-1-У1 ПК-4-В1	Л1.4 Л1.8			Р2
<b>Раздел 4. Элементы памяти вычислительных систем</b>								
4.1	Основная и периферийная память, устройство основной памяти, жёсткий диск, флэш память, удаленная память. /Лек/	1	2	УК-1-31 ПК-4-31	Л1.2 Л1.5Л2.6		КМ1	
4.2	выполнение домашнего задания, подготовка и написание реферата /Ср/	1	15	УК-1-У1 ОПК-4-У1 ОПК-4-У2 ОПК-4-У3 ОПК-4-В1 ОПК-4-В2 ПК-4-В1	Л1.2Л2.6			Р2
<b>Раздел 5. Сенсоры и Актюаторы</b>								
5.1	Характеристики сенсоров, погрешности измерений. Обзор сенсорных систем /Лек/	1	3	УК-1-31 ПК-4-31	Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 Э3		КМ1	
5.2	Расчет характеристики сенсоров: диапазон измерения, чувствительность, точность, линейность, селективность. Погрешности измерений: температурный и временной дрейф параметров, шумы. /Пр/	1	14	ПК-4-У1	Л1.3Л2.3 Э1			Р5
5.3	Измерение параметров магнито индуктивного сенсора на основе магнитного микропровода /Лаб/	1	9	УК-1-В1 ПК-4-У1	Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 Э3			Р6
5.4	Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, подготовка курсовой работы /Ср/	1	13	УК-1-У1 ПК-4-В1	Л1.3Л2.5			

### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

#### 5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	экзамен	УК-1-31;УК-1-32;УК-1-33;УК-1-У1;УК-1-В1;ПК-4-	Часть1 Ответьте на все вопросы (каждый вопрос-2 бала )

		31;ПК-4-У1;ПК-4-В1;ОПК-4-31;ОПК-4-32;ОПК-4-33;ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В1;ОПК-4-В2	<p>1. Число 41 в двоичной системе имеет вид: A) 101001 B) 100101 C) 100111 D) 110001</p> <p>2. Двоичное число 11000101 записывается в десятичной системе как : A) 107 B) 179 C) 197 D) 213</p> <p>3. Гексагональным представлением двоичного числа 11010101 является: A) 6D B) 6E C) C5 D) D5</p> <p>4. Килобайт равняется: A) 2 8 bytes B) 1,000,000 bytes C) 1024 bytes D) 1000 bytes</p> <p>5. Размер регистра в компьютере - A) Всегда 8 bits B) Всегда 16 bits C) Всегда 32 bits D) Зависит от типа компьютера</p> <p>6. Размер файла для цветной фотографии 1024 x 2048 пикселей x 24 bit colour- A) 300 KBytes B) 900 KBytes C) 2.3 MBytes D) 6 Mbytes</p> <p>7. Сколько битов требуется для записи адресов для 256 KByte памяти? A) 8 B) 12 C) 16 D) 18</p> <p>8. Какой из следующих типов памяти является энергозависимым? A) RAM B) ROM C) Magnetic disk D) Optical disk</p> <p>9. Какой из следующих типов памяти является самым быстрым? A) Magnetic Disk</p>
--	--	--	---

			<p>B) ROM C) Dynamic RAM D) Static Ram</p> <p>10. Какой тип памяти используется в кэш ? A) Dynamic RAM B) Static RAM C) Flash D) EPROM</p> <p>11. Какое положение относительно динамической RAM (DRAM) является неправильным? A) Для сохранения информации достаточно поддерживать питание. B) Один бит такой памяти использует один транзистор и один конденсатор. C) Этот тип памяти используется в синхронизированной DRAM (SDRAM). D) Один бит такой памяти является наиболее миниатюрным, то есть такая память обладает высокой плотностью информации.</p> <p>12. Какое положение относительно перпендикулярной магнитной записи (PMR) является неправильным? A) PMR имеет высокую тепловую стабильность из-за большого объема бита. B) Магнитные биты, расположенные перпендикулярно поверхности, позволяют осуществить быстрый доступ к информации. C) Магнитные биты, расположенные перпендикулярно поверхности, позволяют достичь большей плотности записи D) Дальнейшее развитие PMR требует использование многопленочной технологии, что позволяет уменьшить разброс осей анизотропии.</p> <p>13. Какие две технологии позволяют осуществить перезаписывающие оптические диски? A) Формирование на поверхности канавок и выступов. B) Химическое изменение состояния покрытия. C) Фазовые переходы между упорядоченными и неупорядоченными состояниями. D) Магнитооптические среды.</p> <p>14. Определите преимущество магнитооптической записи по сравнению с оптическим методом, использующим изменение фазы состояния (кристаллическая и аморфная). A) Большая плотность записи B) Меньший размер бита C) Более сильный считываемый сигнал D) Более высокая скорость считывания</p> <p>15. С помощью какого процесса логический дизайн процессора переносится на чип? A) Испарительные технологии B) Фотолитография C) Маскировочные технологии D) Распылительные технологии</p>
--	--	--	--



		<p>16. Предполагается, что один бит твердотельной памяти будет иметь размер порядка 10 нм. Какая максимальная плотность записи в Tera-bytes/inch<sup>2</sup> возможна в этом случае? (inch=2.5 см, для простоты: 1 TB=10<sup>12</sup>)</p> <p>A) 625 B) 0.8 C) 6.25 D) 80</p> <p>17. Что не является типом ROM?</p> <p>A) EEPROM B) DRAM C) FLASH D) EPROM</p> <p>Часть 2</p> <p>2.1 С помощью диаграмм объясните расположение битов информации, а также принцип записи и чтения для магнитного жесткого диска</p> <p>2.2. С помощью диаграмм объясните расположение битов информации, а также принцип записи и чтения для оптического диска</p> <p>2. 3 Объем информации на DVD значительно превышает возможности CD. Проведите сравнительный анализ технологий DVD и CD, объясняющий дополнительные возможности DVD.</p> <p>2.4. Эффект магнитосопротивления и его применение для считывающих головок и для сенсоров.</p> <p>2.5. Объясните принцип измерения механического напряжения с помощью эффекта магнитосопротивления</p> <p>2.6. Проведите сравнительный анализ технологий и использования статической RAM (SRAM) и динамической RAM (DRAM).</p>
--	--	---

**5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)**

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	ЛР1	УК-1-31;УК-1-33;УК-1-32;УК-1-У1;ПК-4-31;УК-1-В1;ПК-4-У1;ПК-4-В1	Эллипсометрические методы измерения параметров наноразмерных структур
P2	Реферат	УК-1-31;УК-1-32;УК-1-33;УК-1-У1;ПК-4-31;УК-1-В1;ПК-4-В1	по теме курса

P3	ПР1	ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В1;ОПК-4-В2;УК-1-У1;УК-1-В1;ПК-4-У1;ПК-4-В1	Бинарные системы, элементы памяти
P4	ПР2	ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В1;ОПК-4-В2;УК-1-У1;УК-1-В1;ПК-4-У1;ПК-4-В1	Проектирование функционально-активных материалов и материалов с памятью формы.
P5	ПР3	ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В1;ОПК-4-В2;УК-1-У1;УК-1-В1;ПК-4-У1;ПК-4-В1	Расчет характеристики сенсоров: диапазон измерения, чувствительность, точность, линейность, селективность. Погрешности измерений: температурный и временной дрейф параметров, шумы.
P6	ЛР2	ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В2;ОПК-4-В1;УК-1-У1;УК-1-В1;ПК-4-У1;ПК-4-В1	Измерение параметров магнито индуктивного сенсора на основе магнитного микропровода

### 5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Пример экзаменационного билета дан в приложении. Экзаменационные билеты хранятся на кафедре.

### 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Обучающийся для получения зачета должен выполнить все работы, указанные в данном разделе.

Оценка формируется как среднеарифметическое из оценок за текущие практические работы.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Фарбер В. М., Лежнин Н. В., Хогинов В. А., Селиванова О. В., Лобанов М. Л.	Конструкционные и функциональные материалы на металлической основе: учебное пособие	Электронная библиотека	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014
Л1.2	Муромцев Д. Ю., Яшин Е. Н.	Микропроцессоры и микроЭВМ: учебное пособие	Электронная библиотека	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2013
Л1.3	Родионов Ю. А.	Основы микросенсорики: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019
Л1.4	Шишкин Г. Г., Агеев И. М.	Нанoeлектроника: элементы, приборы, устройства: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
Л1.5	Рыжонков Д. И., Лёвина В. В., Дзидзигури Э. Л.	Наноматериалы: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2017
Л1.6	Морозов В. П.	Измерения и датчики в технических системах: учеб. пособие для студ. обуч. по напр. "Автоматизация и управление"	Электронная библиотека	М.: Изд-во МГТУ, 2012
Л1.7	Крутогин Д. Г.	Функциональные материалы электроники и их технологии: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015
Л1.8		Нано- и микросистемная техника	Библиотека МИСиС	М.: Новые технологии,

<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Сергеев А. Г.	Нанометрология: монография	Электронная библиотека	Москва: Логос, 2011
Л2.2	Петрушевский Ф. И.	Общая метрология: монография	Электронная библиотека	Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца и К°, 1849
Л2.3	Непомнящий О. В., Вейсов Е. А.	Проектирование сенсорных микропроцессорных систем управления: монография	Электронная библиотека	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2010
Л2.4	Вонсовский С. В.	Магнетизм: магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков: монография	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1971
Л2.5	Вавилов В. Д., Тимошенко С. П., Тимошенко А. С.	Микросистемные датчики физических величин: монография	Электронная библиотека	Москва: Техносфера, 2018
Л2.6	Бродин В. Б., Калинин А. В.	Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики	Библиотека МИСиС	М.: ЭКОМ, 2002
Л2.7	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Маренкин С. Ф., Подгорная С. В.	Основы технологии электронной компонентной базы: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015

### **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

Э1	John G. Webster, Halit Ere. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook: Electromagnetic, Optical, Radiation, Chemical, and Biomedical Measurement [Book]. – CRC Press, 2014. – 1921 p. — Режим доступа: Открытый доступ с ID-адресов НИТУ "МИСиС". — URL: <a href="https://doi.org/10.1201/b15664">https://doi.org/10.1201/b15664</a>	<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/96931c7c-067d-3a91-ae84-021e921d444e/">https://www.mendeley.com/catalogue/96931c7c-067d-3a91-ae84-021e921d444e/</a>
Э2	Hartmut Janocha. Actuators: Basics and Applications [Book]. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. - 343p. - Режим доступа: Открытый доступ с ID-адресов НИТУ "МИСиС". — URL: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-662-05587-8">https://doi.org/10.1007/978-3-662-05587-8</a>	<a href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-05587-8#editorsandaffiliations">https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-05587-8#editorsandaffiliations</a>
Э3	Robert A. Schowengerdt. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing [Book]. - Academic Press, 2007. - 560p. - Режим доступа: Открытый доступ с ID-адресов НИТУ "МИСиС". — URL: <a href="https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369407-2.X5000-1">https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369407-2.X5000-1</a>	<a href="https://www.sciencedirect.com/book/9780123694072/remote-sensing">https://www.sciencedirect.com/book/9780123694072/remote-sensing</a>
Э4	Johnson M. Magnetolectronics [Book]. — Elsevier Academic press, 2004. — 410 p. — Режим доступа: Открытый доступ с ID-адресов НИТУ "МИСиС". — URL: <a href="https://doi.org/10.1016/B978-012088487-2/50000-5">https://doi.org/10.1016/B978-012088487-2/50000-5</a>	<a href="https://www.sciencedirect.com/book/9780120884872/magnetolectronics">https://www.sciencedirect.com/book/9780120884872/magnetolectronics</a>
Э5	Joachim Piprek. Optoelectronic Devices: Advanced simulation and analysis [Book]. – Springer Science+Business Media, 2005. – 452 p. – Режим доступа: Открытый доступ с ID-адресов НИТУ "МИСиС". — URL: <a href="https://doi.org/10.1007/b138826">https://doi.org/10.1007/b138826</a>	<a href="https://link.springer.com/book/10.1007/b138826#toc">https://link.springer.com/book/10.1007/b138826#toc</a>

### **6.3 Перечень программного обеспечения**

П.1	Microsoft Office
П.2	MATLAB
П.3	LMS Canvas
П.4	MS Teams

### **6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных**

И.1	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ( <a href="http://elibrary.ru/">http://elibrary.ru/</a> )
И.2	Springerlink ( <a href="https://link.springer.com/">https://link.springer.com/</a> )
И.3	Web of Science (WOS) ( <a href="https://apps.webofknowledge.com">https://apps.webofknowledge.com</a> )
И.4	Scopus ( <a href="https://www.scopus.com/">https://www.scopus.com/</a> )
И.5	Elsevier ( <a href="https://www.sciencedirect.com/">https://www.sciencedirect.com/</a> )
И.6	Электронный курс на платформе LMS CANVAS

#### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus
Любой корпус Компьютерный класс	Учебная аудитория для проведения практических занятий:	экран, проектор, доска, комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, персональные компьютеры, доступ к ЭИОС университета LMS Canvas, лицензионные программы MS Teams, MS Office
К-435	Лаборатория «Физики магнитных материалов»:	спектральный эллипсометрический комплекс, векторный анализатор электрических цепей, петлемер индукционный, смеситель, магнитометр АТЕ-8702, комплект учебной мебели на 8 посадочных мест
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формами работы в аудитории являются лекции, семинарские занятия.

Лекции должны носить установочный и обзорный характер. Студент знакомится с общей проблематикой и терминологией, физико-техническими основами рассматриваемых явлений, физикой работы приборов на основе многокомпонентных наногетероструктур. При представлении материала рекомендуется использовать презентации, подготовленные в Power Point. Слайды должны носить иллюстративный характер и не должны излишне перегружаться текстом и стандартными математическими преобразованиями.

На семинарские занятия вынесены преимущественно теоретические материалы для углубленного изучения наиболее существенных частей дисциплины. Изучение материала семинара иллюстрируется оценочными расчетами и ссылками на литературные источники.